

B82Y ナノ構造物の特定の使用または応用；ナノ構造物の測定または分析；ナノ構造物の製造または処理 [2 0 1 1 . 0 1]

注

注 [2 0 2 6 . 0 1]

1. 国際特許分類 [I P C] 指針の第 1 0 7 . 2 項の趣旨において、このサブクラスは二次分類のためのサブクラスである。従ってこのサブクラスの分類記号は、特許文献に付与される際に分類記号の冒頭に列挙されない。二次分類の分類記号は、発明情報としてかあるいは付加情報としてかのいずれか一方に該当するよう付与できる。

2. このサブクラスは、いずれかの方法により製造されるナノ構造の応用および観点を包含するが、個別の原子または分子の操作により形成されるナノ構造に限定されない。

3. このサブクラスは、他のサブクラスの分類記号とこのサブクラスの分類記号との組み合わせによりナノ構造に関する主題事項の包括的な探索調査が可能になるよう意図されている。従ってこのサブクラスは、国際特許分類 [I P C] の他の分類箇所にもすべてまたは部分的に存在する可能性のあるナノ構造の観点を包含する。

- 5/00 ナノバイオテクノロジーまたはナノ医療、
例、タンパク質工学またはドラッグデリバリー [2 0 1 1 . 0 1]
- 10/00 情報処理、情報記憶または情報伝送のためのナノテクノロジー、例、量子コンピューティングまたは単電子論理回路 [2 0 1 1 . 0 1]
- 15/00 相互作用、感知または駆動のためのナノテクノロジー、例、タンパク質測定のマーカとしての量子ドットまたは分子モータ [2 0 1 1 . 0 1]
- 20/00 ナノ光学、例、量子光学またはフォトニック結晶 [2 0 1 1 . 0 1]
- 25/00 ナノ磁性、例、磁気インピーダンス、異方性磁気抵抗、巨大磁気抵抗またはトンネル磁気抵抗 [2 0 1 1 . 0 1]
- 30/00 材料または表面科学のためのナノテクノロジー、例、ナノ複合材料 [2 0 1 1 . 0 1]
- 35/00 ナノ構造物の測定または分析のための方法または装置 [2 0 1 1 . 0 1]
- 40/00 ナノ構造物の製造または処理 [2 0 1 1 . 0 1]
- 99/00 このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項 [2 0 1 1 . 0 1]